



飛行時間式二次離子質譜儀使用規範

109年05月26日處內會議修訂通過
109年11月10日研發會議收費標準修訂通過
110年01月21日處內會議修訂通過
112年12月13日處內會議修訂通過
113年11月13日處內會議修訂通過

第一條 飛行時間式二次離子質譜儀使用規範之訂定主要在使本儀器能發揮最大使用效益。

第二條 本儀器設備包含：

一、廠牌及型別：ULVAC-PHI TRIFT IV

二、配備：

(一)一次離子槍。

1. Bi cluster ion gun

2. C60 ion gun

(二)三電磁鐵聚焦質量分析儀。

(三)高真空系統。

(四)WinCadence影像處理軟體。

第三條 儀器地點位於藥學暨營養大樓地下室一樓共同儀器中心質譜核心。

第四條 本儀器服務項目包含：

一、表面質譜：全質譜掃描分析表面成份。

二、質譜影像分佈：分析特定分子或離子在表面的分佈情況。

三、縱深分析：分析特定元素在縱向深度的分布情況。

四、大範圍分析(長寬500 μ m以上)、縱向深度超過2 μ m、三維分佈。

第五條 預約使用方法如下：

一、請至共同儀器中心儀器預約系統線上填寫飛行時間式二次離子質譜儀(TOF-SIMS)送樣申請單，經指導教授批核後，由操作員審核安排上機時間，上機費用將依收費標準計費。

二、若因故須取消預約，請務必於預約操作日一天前告知，由技術人員代為取消預約。

三、開放時間：週一至週五，每日上午九時至下午五時。



四、未依預約時間報到送樣，又無事先取消預約者，仍視為正常使用並以原預約時數計費。

第六條 樣品送測規定如下：

- 一、 使用者須自行處理樣品以符合上機規格。
- 二、 樣品須為固體，基底材質總面積直徑小於2公分，厚度小於 0.3 cm，導電度極佳的材質為主，不得具有永磁性、爆炸性、易燃性、腐蝕性、輻射性、毒性和揮發性。
- 三、 每一樣品須分別裝在樣品盒中，盒外註明樣品名稱或編號，樣品背面請勿黏貼黏性物質固定。

第七條 本儀器之收費標準為確保儀器最佳服務品質，以及增加其有效服務年限，經研發會議決議後，使用本儀器之個人或單位，均須分擔儀器使用之耗材、維護、及操作人員服務所須之費用。

一、 收費標準如下：

(一) 校內收費標準：

1. 表面質譜：2000元/30分鐘
2. 分子離子影像：2000元/30分鐘
3. 大範圍分析：3000元/30分鐘
4. 縱深分析：3500元/30分鐘

(二) 校外收費標準：

1. 表面質譜：6000元/30分鐘
2. 分子離子影像：6000元/30分鐘
3. 大範圍分析：9000元/30分鐘
4. 縱深分析：10500元/30分鐘

(三) 本項儀器之收費標準僅計算維護與耗材成本，不含儀器購置費用。請確認您的樣本準備良好，若並非儀器故障導致實驗結果不良，使用者仍必須依收費標準付費。

二、 繳費方式：儀器使用統計及計費作業由共同儀器中心於每個月進行核算，並寄發儀器使用繳費通知予使用者，儀器使用費須於共同儀器中心繳費單開立日期之三個月內繳納核銷。可至本校出納組繳款，或以研究計畫、校內預算核銷。

第八條 為提升儀器使用效益，促進研究成效，本儀器得經自薦、推薦等模式，延請一至二位諮詢指導教授，提供儀器使用、數據解讀等諮詢服務，



並給予該諮詢指導教授使用此儀器費用八折優惠，諮詢指導教授之聯絡方式將公告於儀器專屬網頁。

第九條 貴重儀器之檢測結果，未經同意，不得使用於商業廣告、法律訴訟等用途。

第十條 凡於本中心使用各項儀器設備及服務，請於成果發表時於文章、著作致謝欄中提及我方之貢獻。

第十一條 本規範經研發處處內會議通過後實施，修正時亦同。